

SCIENTIFIC PUBLICATION

Anitua E, Orive G, Aguirre JJ, Ardanza B, Andía I.

5-year clinical experience with BTI dental implants: risk factors for implant failure.

J Clin Periodontology 2008; 35: 724-732.

ABSTRACT

Objetivos: El objetivo de este estudio fue identificar con las pruebas estadísticas apropiadas, los factores de riesgo asociados con el fracaso del implante y evaluar la supervivencia a largo plazo de los implantes dentales empleando la pérdida del implante como variable de resultado y realizando un análisis de los fracasos basado en el implante, la cirugía y el paciente.

Material y métodos: Se utilizó un estudio de cohorte retrospectivo. Mil sesenta pacientes recibieron 5787 implantes BTI durante los años de 2001-2005 en Vitoria, España. Se estudió la posible influencia de las variables demográficas, clínicas, de la cirugía, y las variables protésicas en la supervivencia de los implantes. La supervivencia de los implantes se analizó mediante un análisis de tablas de supervivencia. La regresión de riesgos proporcionales de Cox fue usada para identificar los factores de riesgo relacionados con el fracaso del implante.

Resultados: El hábito de fumar, la posición del implante, las fases quirúrgicas (colocación en dos fases) y la aplicación de técnicas especiales fueron estadísticamente correlacionadas con menores tasas de supervivencia del implante. Dos factores de riesgo asociados con el fracaso del implante fueron detectados en este estudio: las fases quirúrgicas (colocación en dos fases) y el uso de técnicas especiales. Además, las tasas de supervivencia global de los implantes BTI fueron 99,2%, 96,4% y 96% para los análisis basados en el implante, la cirugía y el paciente, respectivamente. 28 de un total de 5.787 implantes (0,48%) se perdieron durante el período de observación. La mayoría de los pacientes con fracaso del implante (69,6%) presentaron periodontitis crónica o agresiva.

Conclusiones: Las fases quirúrgicas (colocación en dos fases) y el uso de técnicas especiales son factores de riesgo para el fracaso del implante.